

Известия высших учебных заведений ЭЛЕКТРОНИКА

Том 21 № 1
2016 январь–февраль

Научно-технический журнал

Издается с 1996 г.

Выходит 6 раз в год

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы электронной техники

- Лысенко А.П., Голубятников В.А., Белов А.Г., Каневский В.Е.* Исследование фотоэлектрических свойств образцов высокоомного теллурида кадмия-цинка 5

Технология микро- и нанoeлектроники

- Гаврилов С.А., Гавриш С.В., Пучнина С.В.* Анализ механизма утечки щелочного металла в стеклокерамических соединениях сапфира с ниобием 13

Микроэлектронные приборы и системы

- Жуков А.В.* Влияние электрон-фононного взаимодействия на обратные токи p – n -переходов на основе GaAs ... 21
- Тимошенков С.П., Горошко В.Н., Симонов Б.М., Петрова В.З.* Применение модифицированного уравнения Гиббса для задач исследования отказов изделий микросистемной техники 28

Нанотехнология

- Федоров И.В., Ромашкин А.В., Емельянов А.В., Неволин В.К., Бобринецкий И.И.* Узкоспектральные фоточувствительные структуры на основе J-агрегатов цианиновых красителей 38
- Громов Д.Г., Дубков С.В., Павлов А.А., Скорик С.Н., Трифонов А.Ю., Кириленко Е.П., Шулятьев А.С., Шаман Ю.П., Рыгалин Б.Н.* Формирование углеродных нанотрубок на пленке аморфного сплава $Ni_{25}Ta_{58}N_{17}$ методом химического осаждения из газовой фазы 48

Микро- и наносистемная техника

<i>Браже Р.А., Савин А.Ф.</i> Емкостные датчики на основе нанотрубных суперконденсаторов	55
--	----

Информационные технологии

<i>Лосевской А.Ю.</i> Исследование физически неклонируемых функций на основе статической памяти.....	61
--	----

Интегральные радиоэлектронные устройства

<i>Зайцев А.А., Петров В.Ф.</i> Методы ускорения переходных процессов в синтезаторах сетки частот	67
---	----

Методы и техника измерений

<i>Смирнов Д.И., Герасименко Н.Н., Овчинников В.В.</i> Применение двухволновой рентгенооптической схемы совместных измерений зеркального отражения и диффузного рассеяния рентгеновского излучения для исследования многослойных тонкопленочных структур	75
--	----

Краткие сообщения

<i>Белов А.Н., Плаксин В.Г., Шевяков В.И.</i> Влияние состояния поверхности затравочного слоя меди на однородность электрохимического заполнения медью каналов с субмикронными размерами	82
--	----

<i>Неустроев С.А.</i> Этан как модель энергетического состояния атомов в кристалле кубического углерода	86
---	----

<i>Комаров В.Т.</i> Импульсный источник питания GaN-транзисторов	88
--	----

<i>Гагарина Л.Г., Федоров П.А.</i> Анализ методов разбраковки на основе 3D-рендеринга в технологическом процессе производства изделий микроэлектроники	91
--	----

Памяти Виталия Дмитриевича Вернера.....	95
---	----

Вернер В.Д. Электроника: от «микро» к «нано» и далее... ..	97
---	----

К сведению авторов	99
--------------------------	----